

27/09/2021

Difracción y propagación computacional

Hemos visto que para valores $r \gg \lambda$ se tiene que la solución de Rayleigh-Sommerfeld es

$$U(x, y, z) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\mathbb{R}^2} U(x', y'; 0) \frac{e^{ikR}}{R} \frac{z}{R} dx' dy',$$

con $R = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2}$. Es necesario transferir del continuo al espacio discreto.

En el caso de Fresnel tenemos

$$U_F(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{\mathbb{R}^2} U(x', y'; 0) e^{i\frac{\pi}{\lambda z} [(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy',$$

entonces vale la pena discretizar una fase cuadrática:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\lambda z}} e^{i\frac{\pi}{\lambda z} x^2}.$$

Entonces hay que determinar el muestreo en el espacio. Sea Δx el espaciado entre muestras, entonces el k -ésimo valor de la fase es

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda z}} e^{i\frac{\pi}{\lambda z} \Delta x^2 k^2}.$$

Para $N_F > 0.25$ se debe tener $\Delta x \leq \lambda z/a$, con a el tamaño característico de la abertura. Escogiendo el espaciado más grande $\Delta x = \lambda z/a$ se tiene que

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda z}} e^{i\frac{\pi}{4N_F} k^2}, \quad \left(\begin{array}{l} \text{en este caso, el número} \\ \text{de elementos debe} \\ \text{ser por lo menos } K = 4N_F \end{array} \right)$$

a suele ser el "diámetro" de la abertura. Para $N_F \leq 0.25$ se debe tener $\Delta x \leq a/M$ con M el muestreo de la abertura. Para $\Delta x = a/M$

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{\lambda z}} e^{i\pi \frac{4N_F}{M^2} k^2}. \quad \left(\begin{array}{l} \text{en este caso el número de} \\ \text{elementos debe de ser} \\ K > M \end{array} \right)$$

Hay varias aproximaciones de la integral del regimen de Fresnel.

- Aproximación de convolución:

En este acercamiento se discretiza la fase cuadrática y el campo en la abertura.

En el caso de una abertura 1D (a lo largo de un eje) si su "diámetro" es w y si la ventana de la fase exponencial es W (donde no necesariamente $w=W$) entonces

→ K muestras para la exponencial con tasa de muestreo $W/\lambda z$.

→ M muestras para la abertura con tasa de muestreo M/w .

Lo que sí debe de ser igual es la tasa de muestreo

$$\frac{W}{\lambda z} = \frac{M}{w} \Leftrightarrow W = \frac{Mw}{4N_F} \Leftrightarrow K = \left\lceil \frac{M^2}{4N_F} \right\rceil$$

donde $N_F = (w/2)^2/\lambda z$. La convolución discretizada es con $U(x', y'; 0) \rightarrow U_{k,p}(0)$ y $\exp(i\pi \dots) \rightarrow h_{n,m}$ con

$$U_{n,m}(z) = \sum_{k=\max(n-K+1,1)}^{\min(n,M)} \sum_{p=\max(m-K+1,1)}^{\min(m,M)} U_{k,p}(0) h_{n-k+1, m-p+1}$$

con $h_{n,m} = \frac{1}{\lambda z} \exp\left[i \frac{4\pi N_F}{M^2} \left\{ (n-K/2)^2 + (m-K/2)^2 \right\}\right]$ para $0 \leq n \leq K-1$

y $0 \leq m \leq K-1$. Sin embargo, un acercamiento más eficiente es utilizando la multiplicación en el dominio de Fourier.

En un programa, antes de multiplicar en el dominio de Fourier o de convolución, se deben de llenar con 0 a $U_{m,n}$ y $h_{n,m}$ para que tengan el mismo tamaño $N=K+M$.

- Transformada de Fresnel o single DFT:

En este caso nos enfocamos en resolver

$$U_F(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{\pi}{\lambda z}(x^2+y^2)} \iint_{\mathbb{R}^2} U(\xi, \eta; 0) e^{i\frac{\pi}{\lambda z}(\xi^2+\eta^2)} e^{-i\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi+y\eta)} d\xi d\eta$$

aunque es exactamente la misma fórmula de Fresnel, el enfoque cambia para resolver la integral. Observamos en el integrando que a medida que z aumenta, el número de oscilaciones en el factor de fase también aumenta. Por lo tanto, un número N_F pequeño aumenta la eficiencia.

Se escoge un tamaño de campo de manera que la abertura quede completamente dentro. Entonces, con el mismo espaciamiento para la abertura y el campo

$$\Delta \xi = \frac{W}{N} = \frac{w}{M},$$

usando $\Delta \xi \Delta f_x = 1/N \Rightarrow \Delta x \Delta f_x = \lambda z / N$. La razón de muestreo es

$$Q = N/M = W/w.$$

Y el arreglo de la abertura ($M \times M$) necesita ser extendido a un campo ($N \times N$). Para evitar aliasing mantener el criterio $M > 4N_F$, entonces

$$U_{n,m}(z) = e^{i \frac{\pi}{4Q^2 N_F} [(n - N/2)^2 + (m - N/2)^2]} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{p=0}^{N-1} U_{k,p}(0) e^{i \frac{4\pi N_F}{M^2} [(k - N/2)^2 + (p - N/2)^2]} e^{-i 2\pi (nk + mp)}.$$

Suponiendo que el arreglo es cuadrado y centrado en $(N/2, N/2)$.

• Función de transferencia de Fresnel:

En este caso es discretizar

$$U_F(x,y;z) = F^{-1} \{ F[U(x,y;0)](f_x, f_y) \cdot H_F(f_x, f_y) \},$$

con $H_F(f_x, f_y) = e^{ikz} e^{-i\pi \lambda z (f_x^2 + f_y^2)}$ la función de transferencia de Fresnel. En este caso a menor distancia de propagación, menos oscilaciones. Usar con N_F grandes. En este método:

→ Muestreo en el plano de abertura: $\Delta x = \frac{W}{N}$.

→ Muestreo en el dominio de frecuencias: $\Delta f_x = 1/w$

→ Entonces, el número de muestras en la abertura es

$$M = \frac{w}{\Delta f_x} N$$

→ Relación entre espacio y frecuencia:

$$x_w(f_x) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{df_x} (\pi \lambda z f_x^2) = \lambda z f_x$$

→ El ancho de banda $B_x = \frac{M}{w} = \frac{1}{\Delta x}$ limita el dominio de frecuencias, entonces

$$w = \lambda z B_x \Leftrightarrow M = \frac{w w}{\lambda z} = 4Q N_f$$

→ Y $N = QM = 4Q^2 N_f$

→ Se tienen que escoger estos parámetros para cada valor de N_f .

Entonces

$$U_{n,m}(z) = \text{DFT}^{-1} \left\{ \text{DFT}[U_{k,p}(0)] e^{-\frac{i\pi}{4Q^2 N_f} [(k - N/2)^2 + (p - N/2)^2]} \right\},$$

donde el arreglo se supone centrado en $(N/2, N/2)$.

La condición $M > 4N_f$ debe ser válida en todo momento, lo cual se puede asegurar con $Q > 1$.

• Función de transferencia exacta:

Se trata de discretizar

$$U(x, y; z) = F^{-1} \left\{ F[U(x, y; 0)] e^{i \frac{2\pi z}{\lambda} \sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2}} \right\},$$

$H(f_x, f_y)$

donde la función de transferencia discretizada es

$$H_{k,p} = \exp \left[i \frac{2\pi z}{\lambda} \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda}{w} \right)^2 \left[\left(k - \frac{N}{2} \right)^2 + \left(p - \frac{N}{2} \right)^2 \right]} \right]$$

→ $\Delta x = \Delta y = w/N$

→ $\Delta f_x = \Delta f_y = 1/w$

$$\Rightarrow M = \frac{w}{\Delta f_x} N$$

Sólo que en este caso hay un corte en $1/\lambda$ (por la raíz cuadrada). Por lo que si $2/\lambda > M/w$, la TF está limitada a M/w y valores son descartados.

→ Sea B_A el ancho de banda de la abertura y B_H la de la TF.

→ Para $B_H \gg B_A$ no hay diferencia a Fresnel \Rightarrow La elección de M depende del criterio de aliasing.

→ Para $B_H \geq B_A$ los efectos del corte de frecuencia se podría ver en el patrón de difracción

→ La fase de la TF dentro de la frecuencia de corte es

$$\phi(f_x, f_y) = \frac{2\pi z}{\lambda} \sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2}$$

→ Relación entre espacio real y espacio de frecuencias:

$$x_w(f_x) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{df_x} \phi(f_x, 0) = - \frac{f_x z \lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2 f_x^2}}$$

la abertura tiene el ancho w entre $x_w(-\frac{M}{2w})$ y $x_w(M/2w)$:

$$w = \frac{Mw}{4N_F \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{\lambda}{\Delta x}\right)^2}}$$

Con $Q = w/w$:

$$Q = \frac{M}{4N_F \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{\lambda}{\Delta x}\right)^2}}$$

entonces $\Delta x < \lambda/2$ tiene límite superior, por lo que $M = w/\Delta x$ también tiene un límite inferior.

→ También $N = QM$.